

AUFSATZ-REDAKTION

Dr.-Ing. Dietmar Aurich, Ltd.
Dir. u. Prof. (verantwortlich)
Dr. Manfred P. Hentschel
Dr. Gerd-Rüdiger Tillack
BAM, Unter den Eichen 87
D-12205 Berlin
Tel. 030/8104-1509
Fax 030/8104-1107

REDAKTION MÜNCHEN

Dipl.-Ing. Angelika Espinosa
Tel. 089/99830-615
Fax 089/99830-623
E-Mail: espinosa@hanser.de

ANZEIGEN

Rolf Hörr
Tel. 089/99830-215
Fax 089/99830-623

ABO/VERTRIEB

Werner Hartmann
Tel. 089/99830-102
Fax 089/984809

VERLAG

Carl Hanser Verlag
Kolbergerstraße 22
D-81679 München
E-Mail: info@hanser.de

NOTIZEN

442

VERANSTALTUNGEN

444

FACHAUFSÄTZE

Miniflachzugproben prüfen
- Richtige Probenentnahme und
zuverlässige Prüfverfahren -
(Djordje Dobi, Eva Junghans) 445

Werkstoff-Ratcheting berechnen
- Qualitativer Vergleich von nicht-
linear-kinematischen Modellen -
(Benedikt Postberg, Eckart Weiß) 451

Spanwurzelentstehung
bei hohen Geschwindigkeiten
- Spanwurzelentstehung mit
Split-Hopkinson-Bar-Methode
simulieren -
(Essam El-Magd,
Christoph Treppmann) 457

Verhindern von Korrosion
bei Klebverbindungen
(Joachim Bischoff,
Otto-Diedrich Hennemann) 461

Glasmatrix-Verbundwerkstoffe
zerstörungsfrei prüfen
- Die Beziehung zwischen innerer
Reibung und Mikrorißenstehung -
(Aldo R. Boccaccini,
Thorsten Tonnesen) 466

Werkstoffkenngrößen mit
digitaler Bildverarbeitung ermitteln
(Eva Kieselstein, Bettina Seiler,
Michael Dost, Bernd Michel) 471

Analysensiebe kalibrieren
- Ergebnisse eines Ringversuchs
für die Charakterisierung eines
Kontrollmaterials -
(Wilfried Hinrichs) 474

Personen zertifizieren
- Ein zunehmender Trend und
seine Auswirkungen -
(Günter Heinke, Klaus Jäger) 482

KURZBERICHT

Mehr Qualität 487

NEUE PRODUKTE 489

INSERENTENVERZEICHNIS 490

VORSCHAU/IMPRESSUM 492

BEZUGSQUELLEN 493

LEO Elektronenmikroskope sind bekannt für innovative Elektronenoptik, höchste Flexibilität für verschiedenste Abbildungs- und Analysetechniken, sowie einfachste Bedienung. Das LEO 922 OMEGA ist ein 200 kV Energiefilter-Transmissionselektronenmikroskop. Es bietet, neben hoher Leistung für Abbildung und Beugung, höchste Vielseitigkeit durch komplette Systemintegration von EELS, ESI und EDX. Es erfüllt in hervorragender Weise alle Erfordernisse für Materialuntersuchungen an dünnen Präparaten wie z.B. die Nanoanalyse von Halbleitern, Keramiken oder Polymeren. Das Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop LEO 1550 mit GEMINI Optik ist ebenfalls für die Nanoanalyse konzipiert. Gleichzeiter An-

bau von EDX und WDX Detektoren an eine große Probenkammer, in Verbindung mit einem kurzen Arbeitsabstand, garantieren höchste Flexibilität für Werkstoffanalysen, sowie höchste Auflösung, selbst bei niedrigsten Beschleunigungsspannungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

LEO Elektronenmikroskopie GmbH
Carl-Zeiss-Str. 56
D-73447 Oberkochen
Tel.: 073 64/94 61 37
Fax: 073 64/94 48 51
E-mail: info@leo.de

